

東京大学地震研究所蛍光 X 線分析装置利用内規

令和 7 年 7 月 24 日制定

(趣旨)

第 1 条 この内規は、東京大学地震研究所（以下「研究所」という。）の蛍光 X 線分析装置（RIGAKU 社製の波長分散型蛍光 X 線分析装置 ZSX Primus II。以下「装置」という。）の利用（研究所が行う公募で採択された利用を除く）について必要な事項を定める。

(装置利用資格)

第 2 条 装置の利用は、学術的研究を目的とする国立大学法人等に所属する研究者又はそれに準ずる者で研究所長（以下「所長」という。）が必要と認めた者とする。

(利用申請)

第 3 条 装置の利用を希望する者は、研究所装置担当教員と事前打合せを行い、装置利用申請書（様式 1）を所長に提出しなければならない。

2 前項の申請内容に変更が生じた場合は、修正した装置利用申請書を再提出するものとする。

(採否)

第 4 条 前条の規定による利用申請の採否は、装置を管理する研究部門・センターの審査に基づき所長が決定する。

(利用料金)

第 5 条 装置の利用料金は、別紙のとおりとする。

2 納付された利用料金の払い戻しは行わない。

(報告書)

第 6 条 装置の利用者は、装置の利用終了後 1 ヶ月以内に装置利用報告書（様式 2）を所長に提出しなければならない。

(補則)

第 7 条 この内規に定めるもののほか、装置の利用に関し必要な事項は所長が定める。

附 則

この内規は、令和 7 年 7 月 24 日から施行する。